

TUZ 2024

Ph.D.
Forum



Darmstadt, 25. bis 27. Februar 2024

36. ITG / GMM / GI - Workshop Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen

Programmkomitee

J. Alt
Infineon Technologies AG
H. Amrouch
TU München
B. Becker
Universität Freiburg
R. Drechsler
Uni Bremen und DFKI
S. Eggersglüß,
Siemens Digital Industries Software
P. Engelke
Infineon Technologies AG
G. Fey
TU Hamburg
A.-P. Fonseca Müller
Bosch Sensortec GmbH
M. Gössel
Universität Potsdam
S. Hellebrand
Universität Paderborn
K. Hofmann
TU Darmstadt
S. Holst
Kyushu Institute of Technology
W. Hoppe
Rheinmetall AG
S. Huhn
Siemens Digital Industries Software
M. Kampmann
Siemens Digital Industries Software
R. Krenz-Baath
Hochschule Hamm-Lippstadt
M. Krstic
Uni Potsdam und IHP GmbH
V. Petrovic
HDL Design House
L. Bolzani Poehls
RWTH Aachen
I. Polian
Universität Stuttgart
F. Pöhl,
Frank Poehl Consulting
S. Sattler
Uni Erlangen-Nürnberg
M. Sauer
Advantest Europe GmbH
M. Schillinsky
NXP Semiconductors Germany GmbH
H. Schmidt
IBM Deutschland GmbH
M. Schölzel
Hochschule Nordhausen
J. Sepulveda
Airbus Defence and Space
M. Tahoori
KIT
D. Tille
Infineon Technologies AG
M. Wahl
Universität Siegen
H.-J. Wunderlich
Universität Stuttgart

Der Workshop „Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen“ ist das bedeutendste deutschsprachige Forum, um Trends, Ergebnisse und aktuelle Probleme auf dem Gebiet des Tests, der Diagnose und der Zuverlässigkeit digitaler, analoger, Mixed-Signal- und HF-Schaltungen zu diskutieren.

Das **TUZ Doktorandenforum** ist ein neu eingeführtes Format, welches darauf abzielt, den Austausch von Ideen, Erfahrungen und Perspektiven junger Doktoranden aus dem Bereich Test und Zuverlässigkeit zu fördern. Die Doktoranden stellen ihre aktuellen Forschungsarbeiten im Rahmen einer Postersitzung vor und erhalten dabei die Möglichkeit, mit Spezialisten sowohl aus dem akademischen Bereich als auch aus der Industrie zu diskutieren und Feedback zu erhalten. Dieses neue Format bietet auch für Experten aus der Industrie und Wissenschaft die Möglichkeit, mit Nachwuchswissenschaftlern zusammenzutreffen.

Wir begrüßen Forschungsthemen unter anderem aus den folgenden Bereichen:

- Adaptive Systeme (z.B. Selbstreparatur, self-healing, self-awareness)
- Automatisches Test-Equipment, Testautomatisierung, Testprogramme und Testmodellierung
- Defekt- und Fehlermodellierung
- Diagnose von Ausfallursachen
- Fehlertoleranz, Resilienz, Robuste und strahlenresistente Systeme
- Funktionale Sicherheit
- Hardware-orientierter Test und Hardware-orientierte Sicherheit
- Statistische und maschinelle Lernverfahren für Test und Zuverlässigkeit
- Systemtest und –zuverlässigkeit
- Test und Simulation von Mixed-Signal, HF- und Analog-Schaltungen
- Testerzeugung, Fehlersimulation, Selbsttest und Online-Test
- Testgerechter Entwurf, DFT Methodik
- Testkosten und Qualität
- Teststandards, z.B. IEEE 1149.x, IEEE 1687.x, IEEE P1838

Der Workshop findet im Georg-Christoph-Lichtenberg-Haus in Darmstadt statt und wird von der Technischen Universität Darmstadt organisiert. Es ist geplant die Veranstaltung vollständig in Präsenz durchzuführen.

Interessierte Doktoranden werden gebeten, die Zusammenfassung ihrer Forschungstätigkeit und die bisherigen Ergebnisse im Umfang von maximal 2 Seiten über die Workshop-Homepage einzureichen. Der Beitrag sollte den Zweck der Forschung, den Neuigkeitsgehalt und Aspekte der einer möglichen späteren Anwendung beschreiben.



Workshop-Homepage

www.tuz-workshop.de
Submission-Seite
<https://easychair.org/conferences/?conf=tuz24>

Wichtige Termine

Einreichung von Beiträgen: 28.01.2024
Benachrichtigung der Autoren: 31.01.2024

Tagungsleitung

Prof. Dr.-Ing. Klaus Hofmann
TU Darmstadt
E-Mail: Klaus.Hofmann@ies.tu-darmstadt.de

Programmkomitee-Vorsitzender

Dr.-Ing. Sebastian Huhn
Siemens Digital Industries Software
E-Mail: Sebastian.Huhn@siemens.com

Veranstalter

GI FA 3.5 / GMM FA 6.5/ ITG FA 8.2 RSS Kooperationsgemeinschaft rechnergestützter Schaltungs- und Systementwurf



GMM

VDE ITG